

PCT/FR 03/03887

REC'D 2 2 MAR 2004

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

> Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

> > Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÉGLE 17.12) OU b)

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

SIEGE 26 bts, rue de Saint Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23 www.lnpt.fr

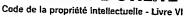
Part Thusse

DIGITO MATIONAL COCC DAD LA LOL ME ST. 444 DIL LO AUDIL



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ





26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécople : 33 (1) 42 94 86 54

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2



Réser	vé à l'INPI		Cet imprime est a rem	plir lisiblement à l'encre noire	08 540 @ W / Q108
REMISE DES PIÈCES DEC 200	<u>₩₩₩₩₩</u>		NOM ET ADRESS	SE DU DEMANDEUR OU DU MA	NDATAIRE
LIEU 75 INPI PARIS	~		À QUI LA COR	RESPONDANCE DOIT ÊTRE AD	RESSÉE
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI	216711		CABINET PLAS	SERAUD	
DATE DE DÉPÂY ATTRIBUÉS			84 RUE D'AMS	TERDAM	
PAR L'INPI	2 6 DEC. 200	กร	75009 PARIS		
Vos références pour ce dossi	a man and	JE.			
(facultatif) AH/EMA-BFF020	288		·		Ð
Confirmation d'un dépôt par			l'INPI à la télécopie		
2 NATURE DE LA DEVIANDE	or to the least the first of the		4 cases suivantes		
Demande de brevet		K			A PARTICIPATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT
Demande de certificat d'utili	té				
Demande divisionnaire	1				·
Demande d	de brevet initiale	N°		Date LILI	1
ou demande de certificat	d'utilité initiale	N°		Date LILII	_
Transformation d'une deman	nde de	П			
brevet européen Demande d		N°		Date	ŀ
TITRE DE L'INVENTION (2	00 caractères ou es	spaces maximum)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>
				•	
PROCEDE DE FABRICA	ATION D'UN CO	OMPOSE I-III-VI2	2 EN COUCHES MI	NCES, FAVORISANT	•
L'INCORPORATION D'E	LEMENTS III		•		•
DÉCLARATION DE PRIORI	TÉ F	Pays ou organisation			
OU REQUÊTE DU BÉNÉFIC	l r	Date	, ! .! <u>. </u>	No	
	10	Pays ou organisation	1	•	
LA DATE DE DÉPÔT D'UNE	E D	Date		N _o	
DEMANDE ANTÉRIEURE F		Pays ou organisation	1		
	l D	Date		No	
	L L			la case et utilisez l'imprimé	«Suite»
DEMANDEUR (Cochez l'une	des 2 cases)	Z Personne mo	orale	Personne physique	2. 19 / Third
Nom	E	FOTRICITE DE	FRANCE, Service	<u>したアプラスとと、おも、「気を作り入れ」とは</u> も問題でし	The state of the s
ou dénomination sociale	1		E PRANCE, SELVICE	National	
Prénoms					5 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Forme juridique E					
	E	Etablissement Pu	blic à caractère indu	ustriel et commercial.	h Detroit
N° STREN	E	Etablissement Pu	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ustriel et commercial.	5.9±433
	E		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ustriel et commercial.	5. Destrict (1)
N° SIREN Code APE-NAF Domicile Rue				ustriel et commercial.	* P. P. STANE !
N° SIREN Code APE-NAF Domicile Rue ou	2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Wagram	ustriel et commercial.	
N° SIREN Code APE-NAF Domicile Rue			Wagram	ustriel et commercial.	* P * * * * * * * * * * * * * * * * * *
N° SIREN Code APE-NAF Domicile Rue ou siège Code postal e		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Wagram	ustriel et commercial.	
N° SIREN Code APE-NAF Domicile Rue ou Code postal el Pays		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Wagram		5.9-2-3-3
N° STREN Code APE-NAF Domicile Rue ou Code postal el Pays Nationalité	t ville [7	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Wagram		



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2



REMISE DES PIÈCES DATE 20 DE				
UEU 75 INFI	PARIS			
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR	0216711 RUNPI			DB 540 ⊕ W / 010801
Vos références ((facultatif)	oour ce dossier :	AH/EMA-BFF020		
E HIAMDATAIT	E (sily a lieu)			
Nom				
Prénom				
Cabinet ou S	ociété	CABINET PLAS	SERAUD	
N °de pouvoi de lien contra	r permanent et/ou actuel			
Advesce	Rue	84 RUE D'AMST	ERDAM	
Adresse	Code postal et ville	[7 15 10 10 19] PA	RIS	
	Pays	FRANCE		
	one (facultatif)	01 44 63 41 11		
1	ple (facultatif)			
	tronique (facultatif)	7 7 1985 2 7 7 8 7 1 8 1 1 8 1 1 8		en e
M INVENTEUR	r (s)	Les inventeurs s	ont nécessairement des	personnes physiques
1	eurs et les inventeurs nes personnes	Oui Non: Dans	ce ças remplir le formul	aire de Désignation d'inventeur(s)
RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pou	r une demande de breve	t (y compris division et transformation)
	Établissement immédiat ou établissement différé			
Palement éc	helonné de la redevance (en deux versements)	Uniquement pour Oui Non	les personnes physiques (effectuant elles-mêmes leur propre dépôt
RÉDUCTION DES REDEV		Uniquement pour les personnes physiques Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposite Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de décision d'admission à l'assistance gratuile ou indiquer sa référence): AG		invention (joindre un avis de non-imposition) cette invention (joindre une copie de la
	z utilisé l'imprimé «Suite», nombre de pages jointes	1 PAGE		
OU DU MAI (Nom et qu	e Du DEMANDEUR NDATAIRE valité du signataire) VERDURE (CPI n° 97-090	1)	Access of the second	VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI



ANTORAL OR MATIONAL OR MATI

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

N° 11354°02

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

ge suite N° 1../1.



	Réservé à l'INPI		9	rage s	suite in/:	· the Mark
REMISE DES PIÈCES E	C 2002			•		
LIEU 75 INPI						
LC	021671	18				
Nº D'ENREGISTREMENT		4				
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR	LINPI		Cet imprimé est	à remplir lisiblem	ent à l'encre noire	08 829 € W / 1606
Vos références p	our ce dossier (facultatif)	AH/EMA-BFF020	288			-
M DÉCLARATIO	N DE PRIORITÉ	Pays ou organisation				
	E DU BÉNÉFICE DE	Date L		No		
-	E DÉPÔT D'UNE	Pays ou organisation	,			
	NTÉRIEURE FRANÇAISE	Date LILL	4.4.4.1	Ио		
DEMANDE A	MIERIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisation	1	MO		
(23 pengantiri	8941161 1838848 W.Z. 183	Date 1 1	45. 1177500 a.m.	N°	oter () : See Manual transmission (see Ma	eterior such State 1.18
	R (Cochez l'une des 2 cases					
Nom ou dénominat	iam anniata	CENTRE NATIO	NAL DE LA RE	CHERCHE SC	XENTIFIQUE - CN	RS
	ion sociale	ļ			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Prénoms						'
Forme juridiqu	ue	Etablissement Pu		ue et Technolo	gique EPST	<u></u>
N° SIREN	-				······································	·
Code APE-NA	F			····	·	1.5
Domicile ou	Rue	3, RUE MICHEL	ANGE		· •	
siège	Code postal et ville	17 15 17 19 14 1 PAF	RIS Cedex 16			. (.
	Pays	FRANCE		•	.;	
Nationalité		FRANCAISE				7
N° de télépho	ne (facultatif)				•	
N° de télécop			·		·	
	ronique (facultatif)		·			·
DEWANDEUR	R (Cochez l'une des 2 cases	Personne more	le tale	: Person	në physique	The same of the
Nom						
ou dénominat	ion sociale			···		
Prénoms				•		
Forme juridiqu	ue					
N° SIREN		<u> </u>				
Code APE-NAI	r .			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Domicile ou	Rue		•			
siège	Code postal et ville		·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Pays					
Nationalité						
N° de télépho						
N° de télécop						
Adresse électr	ronique (<i>facultalif</i>)				·	
OU DU MAR		nane VERDURE n° 97-0901)	en and		VISA DE LA PRÉF OU DE L'INF	

Procédé de fabrication d'un composé I-III-VI2 en couches minces, favorisant l'incorporation d'éléments III

La présente invention concerne la fabrication de semi-5 conducteurs de type $I-III-VI_2$ en couches minces, notamment pour la conception de cellules solaires.

Les composés I-III-VI $_2$ de type $\text{CuIn}_{(1-x)}\text{Ga}_x\text{Se}_y\text{S}_{(2-y)}$ (où x est sensiblement compris entre 0 et 1 et y est sensiblement compris entre 0 et 2) sont considérés comme très prometteurs et pourraient constituer la prochaine génération de cellules photovoltaïques en couche mince. Ces composés ont une largeur de bande interdite directe comprise entre 1,05 et 1,6 eV qui permet une forte absorption des radiations solaires dans le visible.

10

15

Les rendements records de conversion photovoltaïque ont été obtenus en préparant des couches minces par évaporation sur de petites surfaces. Cependant 20 l'évaporation est difficile adapter à à l'échelle industrielle en raison de problèmes de non-uniformité et de faible utilisation des matières premières. pulvérisation cathodique (méthode dite de "sputtering") est mieux adaptée aux grandes surfaces mais elle nécessite des équipements sous vide et des cibles de précurseurs 25 très coûteux.

Il existe donc un réel besoin pour des techniques alternatives à faible coût et à pression atmosphérique. La technique de dépôt de couche mince par électrochimie, en particulier par électrolyse, se présente comme une

alternative très séduisante. Les avantages de cette technique de dépôt sont nombreux et notamment les suivants:

- dépôt à température et pression ambiantes dans un bain d'électrolyse,
 - possibilité de traiter de grandes surfaces avec une bonne uniformité,
 - facilité de mise en œuvre,

5

- faible coût d'installation et des matières premières 10 (pas de mise en forme particulière, taux d'utilisation élevé des matières), et
 - grande variété des formes possibles de dépôt, due à la nature localisée du dépôt sur le substrat.
- Malgré de nombreuses recherches dans cette voie, les difficultés rencontrées ont porté sur le contrôle de la qualité des précurseurs électrodéposés (composition et morphologie) et, plus particulièrement, sur la difficulté d'insérer des métaux tels que le gallium ou l'aluminium (éléments III) dont le potentiel d'électrodéposition est très cathodique.

On note ci-après les composés I-III- VI_2 où :

- l'élément I correspond à Cu,
- 25 l'élément III correspond à In et à Ga et/ou Al, et
 - l'élément VI correspond à Se et/ou S, par l'abréviation "CIGS".

Par ailleurs, on entend par le terme "film", une couche mince déposée sur substrat et par le terme "film de précurseurs", une couche mince de composition globale

voisine de I-III-VI $_2$ et directement obtenue après le dépôt par électrolyse, sans traitement ultérieur éventuel.

En ce qui concerne l'électrodéposition pure de CIGS (sans étape d'évaporation), la morphologie et la composition des précurseurs est très difficile à contrôler, comme l'indique les documents :

5

10

- "One step electrodeposited CuIn_{1-x}Ga_xSe₂ thin films: structure and morphology", Fahourme M., Chraibi F., Aggour M., Delplancke J.L., Ennaoui A., and Lux-Steiner M, 17th European Photovoltaic Solar Energy Conference, 22-26 October 2001, Münich; Allemagne; et
- "CuIn_{1-x}Ga_xSe₂-based photovoltaic cells from electrodeposited precursor films", Materials Research Society Symposium - Proceedings, Volume 668,2001, Pages H8101-H8106, Bhattacharya, R.N., Fernandez, Arturo M.

développements les plus récents font suivre l'électrodéposition d'une étape d'évaporation afin 20 d'accroître teneurs les en In et Ga des films électrodéposés. Dans ces développements notamment décrits dans le document WO-01/78154, l'électrodéposition est une co-déposition réelle des éléments Cu, In, Ga et Se (pour l'obtention d'un alliage quaternaire) et elle met en œuvre un procédé de dépôt dans un bain électrolytique tamponné 25 en pH. La solution tampon est composée d'acide sulfamique et de biphtalate de potassium, formant un tampon de type pHydrion (marque déposée). Des films électrodéposés ayant donné des cellules photovoltaïques par le procédé hybride 30 mettant en œuvre un électrodépôt suivi d'une

d'évaporation, ont une morphologie dendritique et peu compacte.

La présente invention vient améliorer la situation.

5

Elle propose à cet effet un procédé de fabrication par électrochimie d'un composé $I-III-VI_y$ en couches minces, où y est voisin de 2, comportant les étapes suivantes :

- on prévoit un bain d'électrolyse comportant au moins un élément III dissous dans le bain et au moins deux électrodes immergées dans le bain, et
 - on applique une différence de potentiel entre les deux électrodes pour amorcer la formation d'une couche mince de I-III-VI_y sur la surface de l'une des électrodes.

15

10

Selon l'invention, le bain d'électrolyse comporte en outre au moins un composé tensioactif pour favoriser l'incorporation de l'élément III dans ladite couche.

20 Avantageusement, l'élément III comporte du gallium et/ou de l'aluminium.

Préférentiellement, le composé tensioactif comporte une formule chimique du type $CH_3(CH_2)_nO-SO_3-X$, où n est supérieur ou égal à 5 et X est une espèce atomique telle que H, Na, Li ou K.

Dans un mode de réalisation préféré, le composé tensioactif comporte du dodécylsulfate de sodium. En variante ou en complément, le composé tensioactif comporte du 2-Butyne-1,4-diol et/ou de l'acide maléique et/ou de l'acide succinique et/ou de l'acide fumarique et/ou de l'acide crotonique.

5

De préférence, la concentration de tensioactif dans le bain d'électrolyse est sensiblement d'un même ordre de grandeur que la concentration en gallium et/ou en aluminium.

10

15

20

D'autres avantages et caractéristiques de l'invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée ciaprès de modes de réalisation donnés à titre d'exemples non limitatifs, ainsi qu'à l'examen des dessins qui l'accompagnent et sur lesquels :

- la figure 1 représente schématiquement une couche mince obtenue par la mise en œuvre du procédé selon l'invention,
- la figure 2 représente schématiquement un bain d'électrolyse pour la mise en œuvre du procédé selon l'invention,
- la figure 3 représente schématiquement l'aspect d'une couche mince de l'art antérieur, vue de dessus,
- et la figure 4 représente schématiquement une vue en coupe d'une couche mince de l'art antérieur, en formation.

25

30

référant à la figure 1, des couches diséléniure de cuivre et d'indium-gallium (en qu'élément III) sont obtenues à pression et température ambiantes par électrodéposition d'une couche mince précurseurs de composition et de morphologie adaptée, sur un substrat de verre S recouvert de molybdène MO.

L'électrodéposition est effectuée à partir d'un bain acide B (figure 2), agité par des pales M, contenant un sel d'indium, un sel de gallium, un sel de cuivre et de l'oxyde de sélénium dissous. Les concentrations de ces éléments précurseurs sont comprises entre 10^{-4} et 10^{-2} M, où la notation "M" correspond à l'unité "mole par litre". Le pH de la solution est fixé entre 1 et 4.

10 Trois électrodes An, Ca et REF, dont :

- une électrode de molybdène Ca sur laquelle se forme la . couche mince par électrodéposition,
- et une électrode de référence au sulfate mercureux REF, y sont immergées dans le bain B.

15

5

La différence de potentiel électrique appliquée à l'électrode de molybdène est comprise entre -0,8 et -1,4 V par rapport à l'électrode de référence REF.

Des couches d'épaisseur comprise entre 1 et 4 microns sont obtenues, avec des densités de courant comprises entre 0,5 et 10 mA/cm².

Dans des conditions définies de composition, d'agitation de la solution et de différence de potentiel, il est possible d'obtenir des couches denses, adhérentes, de morphologie homogène et dont la composition est proche de la composition stœchiométrique : Cu (25%), In+Ga (25+&%) et Se (50%), avec un ratio atomique (In+Ga)/Cu légèrement supérieur à 1. On peut ainsi réaliser des dépôts sur des surfaces de 10x10 cm²

Néanmoins, l'incorporation de gallium pour former couches minces de CIGS pose souvent un problème, tant sur le plan de leur morphologie que de leur composition. En se référant à la figure 3, les couches de précurseurs CO, en 5 formation par électrolyse dans des conditions classiques, présentent à la surface des protubérances PR formant un angle lpha non nul par rapport au plan principal de la surface de la couche (figure 4). Une telle morphologie de la couche mince, particulièrement rugueuse en sa surface, 10 n'est pas compatible avec la fabrication de cellules photovoltaïques, lesquelles nécessitent des interfaces les plus parallèles et planes possibles pour limiter déperdition de lumière et surtout éviter des courtscircuits locaux (ou "shunts"). 15

En outre, la composition en volume de ces dépôts est pauvre en gallium (généralement inférieure à 5%) et inférieure, en tout état de cause, à celle initialement souhaitée.

20

25

30

L'approche proposée dans le document WO-01/78154 consiste à contrôler l'acidité du bain d'électrolyse pour assurer la stabilité de son pH et, de là, favoriser une incorporation du gallium (élément dont le potentiel de dépôt est très négatif) dans les couches de CIGS en formation. A cet effet, il est prévu dans ce document une solution tampon comprenant de l'acide sulfamique et du biphtalate de potassium en concentrations suffisantes pour assurer la stabilité du pH. Des couches de CuIn_(1-x)Ga_xSe₂ sont alors obtenues avec x voisin de 9%.

Dans une autre approche, la présente invention propose d'ajouter un ou plusieurs additifs tensioactifs dans le bain d'électrolyse pour former les couches de CIGS. Des couches de $CuIn_{(1-x)}Ga_xSe_2$ obtenues par la mise en œuvre du procédé selon l'invention présentent une morphologie satisfaisante, ainsi qu'un pourcentage x de voisin, voire supérieur, à la valeur de 9% précitée, comme le verra plus loin en référence à un réalisation préféré.

5

10

Une explication possible de cette amélioration de la qualité des couches par ajout de tensioactifs dans le bain est la suivante. L'ajout d'un composé tensioactif, agissant dans le bain en s'adsorbant à l'électrode Ca sur 15 laquelle se forme la couche mince, permet de modifier la tension de surface à l'interface entre la couche mince en formation et la solution du bain. On abaisse ainsi l'énergie d'activation de la réaction d'incorporation du gallium combiné au sélénium dans la couche mince. 20 mélange du gallium aux autres éléments Cu, In et Se permet alors d'obtenir une morphologie homogène de la couche, ainsi qu'une composition riche en gallium.

Une autre explication possible, complémentaire 25 la précédente, est que les tensioactifs utilisés peuvent en avoir un rôle inhibiteur de la réaction de d'hydrogène dégagement observée habituellement en électrolyse, ce qui permettrait l'application de 30 potentiels plus cathodiques, favorisant ainsi 'incorporation de gallium.

On note en outre un effet niveleur des tensioactifs ajoutés, permettant d'aplanir la surface de la couche en formation.

5

selon l'invention, un ou plusieurs additifs tensioactifs permettant d'améliorer la morphologie et/ou changer les ratios relatifs des divers éléments électrodéposés (Cu-In-Ga-Se) sont ajoutés dans solution. On retiendra que leur rôle principal est d'aider à l'insertion du gallium dans les couches de précurseurs. La quantité de gallium pouvant être insérée dans les films peut varier de 0 à 30 % (en pourcentage atomique). La concentration des additifs peut varier de 10⁻⁵ à 10⁻² M.

15

10

On donne ci-après différents modes de réalisation de l'invention, avec comme additifs tensioactifs :

- le dodécylsulfate de sodium;
- le 2-Butyne-1,4-diol;
- 20 l'acide succinique;
 - l'acide fumarique;
 - l'acide maléique.

Mode de réalisation préféré: "dodécylsulfate de sodium"

Un dépôt typique est réalisé à partir d'un bain acide dont les concentrations en éléments précurseurs et en tensioactif CH3 (CH2) 110SO3Na sont les suivantes :

 $[CuSO_4] = 4, 5.10^{-3} M,$

 $[In_3(SO_4)_3] = 2, 5.10^{-3} M,$

30 $[Ga_2(SO_4)_3] = 2, 5.10^{-3} M,$ $[H_2SeO_3] = 7, 5.10^{-3} M,$ $[CH_3(CH_2)_{11}OSO_3Na] = 20.10^{-3} M.$

Les précurseurs sont déposés par une réaction cathodique à potentiel imposé, à -1.1 V par rapport à l'électrode REF. La densité de courant est de -5 mA/cm².

Tableau I : Analyse de la composition d'un film de CIGS électrodéposé dans une solution contenant du dodécylsulfate de sodium.

10

5

Elément	%Atomique
Cu	20.70
Ga	10.27
Se	50.94
In	18.10

Avantageusement, la morphologie de la couche est très homogène.

De façon plus générale, on indique que l'ajout de tensioactifs de formule $CH_3(CH_2)_nO-SO_3-X$ (où n est supérieur ou égal à 5 et X est une espèce atomique telle que H, Na, Li ou K) donne des résultats satisfaisants.

20

Second mode de réalisation : "2-Butyne-1,4-dio1"

Un dépôt typique est réalisé à partir d'un bain acide dont les concentrations en éléments précurseurs et en tensioactif $HO-CH_2-C\equiv C-CH_2-OH$ sont les suivantes :

25 $[CuSO_4] = 4, 5.10^{-3} M,$

$$[In_2(SO_4)_3] = 2,5.10^{-3} M,$$

 $[Ga_2(SO_4)_3] = 2,5.10^{-3} M,$
 $[H_2SeO_3] = 7,5.10^{-3} M,$
 $[HO-CH_2-C = C-CH_2-OH] = 20.10^{-3} M.$

5

25

Les précurseurs sont déposés par une réaction cathodique à potentiel imposé, à -1,1 V par rapport à l'électrode REF. La densité de courant est de -5 mA/cm².

10 <u>Tableau II</u>: Analyse de la composition d'un film de CIGS électrodéposé dans une solution contenant du 2-Butyne-1,4-diol.

Elément	%Atomique
Cu	23.10
Ga	1.80-
Se	53.50
In	21.54

La morphologie de la couche est peu homogène. Toutefois, aucun décollement de la couche n'a été observé.

Troisième mode de réalisation: "acide maléique"

Un dépôt typique est réalisé à partir d'un bain acide dont 20 les concentrations en éléments précurseurs et en tensioactif HO₂C-CH=CH-CO₂H sont les suivantes :

 $[HO_2C-CH=CH-CO_2H]=20.10^{-3} M.$

Les précurseurs sont déposés par une réaction cathodique à potentiel imposé, à -1,1 V par rapport à l'électrode REF. La densité de courant est de -5 mA/cm².

<u>Tableau III</u>: Analyse de la composition d'un film de CIGS électrodéposé dans une solution contenant de l'acide maléique.

10

5

Elément	%Atomique
Cu	23.32
Ga	3.10
Se	53.32
In	20.26

La morphologie de la couche est sensiblement homogène.

Quatrième mode de réalisation : "acide succinique"

Un dépôt typique est réalisé à partir d'un bain acide dont les concentrations en éléments précurseurs et en tensioactif HO₂-CH₂-CO₂H sont les suivantes :

[CuSO₄] =4,5.10⁻³ M,

20 $[In_2(SO_4)_3] = 2,5.10^{-3} M,$ $[Ga_2(SO_4)_3] = 2,5.10^{-3} M,$ $[H_2SeO_3] = 7,5.10^{-3} M,$ $[HO_2-CH_2-CO_2H] = 20.10^{-3} M.$ Les précurseurs sont déposés par une réaction cathodique à potentiel imposé, à -1,1 V par rapport à l'électrode REF. La densité de courant est de -5 mA/cm².

5 <u>Tableau IV</u>: Analyse de la composition d'un film de CIGS électrodéposé dans une solution contenant de l'acide succinique.

Elément	%Atomique
Cu	23.69
Ga	3.99
Se .	52.33
In	19.99

10 La morphologie de la couche est avantageusement homogène.

Cinquième mode de réalisation: "acide fumarique"

Un dépôt typique est réalisé à partir d'un bain acide dont les concentrations en éléments précurseurs et en tensioactif HO2-CH-CH-CO2H sont les suivantes :

 $[CuSO_4] = 4, 5.10^{-3} M,$

 $[In_2(SO_4)_3] = 2,5.10^{-3} M,$

 $[Ga_2(SO_4)_3] = 2,5.10^{-3} M,$

20 $[H_2SeO_3] = 7,5.10^{-3} M,$ $[HO_2-CH-CH-CO_2H] = 20.10^{-3} M.$

Les précurseurs sont déposés par une réaction cathodique à potentiel imposé, à -1,1 V par rapport à l'électrode REF.

25 La densité de courant est de -5 mA/cm².

5

15

20

25

Elément	%Atomique
Cu	24.54
Ga	2.85
Se	52.60
In	20.00

La morphologie de la couche est sensiblement homogène.

- De manière plus générale, l'additif au sens de l'invention peut être un composé tensioactif parmi les deux classes suivantes :
 - les composés tensioactifs dont la molécule contient le groupement $X-SO_3-Y$ ou $Z-SO_2-Z^{\,\prime}$, où :
 - o Y est un élément parmi H, Na, Li, K;
 - o X est un groupe insaturé (éthylénique, aromatique, acétylénique) pouvant comporter des hétéro-atomes, avec un nombre d'atomes de carbone quelconque, ou encore un groupe saturé pouvant comporter des hétéro-atomes;
 - o Z et Z' sont des groupements saturés ou insaturés pouvant comporter des hétéro-atomes (S, N, ou autres),
 - et les composés dont la molécule possède au moins un groupe polaire : -OH- COOH, -S (ou autre hétéro-

atome) et/ou un groupement insaturé : alcène, alcyne, aromatique (avec ou sans hétéro-atome), permettant l'adsorption de la molécule au cours de l'électrodépôt.

5

Chaque composé de l'une des deux familles peut être utilisé seul ou en mélange. Un même composé peut appartenir aux deux familles (s'il possède au moins un groupement insaturé et au moins un groupement de SO₂).

10

On indique que ces composés tensioactifs se distinguent des solvants organiques habituels dont le rôle de solvatation agit seulement sur la solution du bain. Ils se distinguent aussi des additifs organiques introduits dans le bain d'électrolyse pour en stabiliser le pH.

15

Les composés tensioactifs décrits ci-avant peuvent être aisément utilisés pour tout type de bain d'électrolyse permettant l'électrodéposition de systèmes I-III-VI tels que Cu-In-Ga-Al-Se-S.

25

20

Les agents tensioactifs permettant d'insérer du gallium dans les couches de précurseurs permettent ainsi de résoudre plusieurs difficultés décrites dans l'état de l'art (mauvais contrôle de la morphologie, de la composition des précurseurs, en particulier pour ce qui concerne le taux de gallium, difficultés d'extension aux grandes surfaces).

Bien entendu, la présente invention ne se limite pas à la forme de réalisation décrite ci-avant à titre d'exemple ; elle s'étend à d'autres variantes.

Ainsi, on comprendra que l'aluminium, en tant qu'élément 5 III, pose sensiblement les mêmes problèmes d'incorporation dans les couches de Cu-In-Al-Se que le gallium. A ce l'invention peut s'appliquer en outre fabrication des telles couches. Par ailleurs, on introduit habituellement de l'indium en excès dans la solution du 10 bain pour favoriser son incorporation dans la couche, 1'indium se combinant, en tant qu'élément III, sélénium. On indique que l'ajout de tensioactifs dans le bain devrait aussi favoriser l'incorporation de l'indium, 15 en tant qu'élément III, dans la couche.

Par ailleurs, on indique en outre que l'acide crotonique, en tant qu'additif tensioactif, a aussi fourni des résultats satisfaisants.

Revendications

5

25

- 1. Procédé de fabrication par électrochimie d'un composé $I-III-VI_y$ en couches minces, où y est voisin de 2, comportant les étapes suivantes :
- on prévoit un bain d'électrolyse comportant au moins un élément III dissous dans le bain et au moins deux électrodes immergées dans le bain,
- on applique une différence de potentiel entre les deux électrodes pour amorcer la formation d'une couche mince de I-III-VI, sur la surface de l'une des électrodes,

caractérisé en ce que le bain d'électrolyse comporte en outre au moins un composé tensioactif pour favoriser l'incorporation de l'élément III dans ladite couche.

- 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'élément III comporte du gallium et/ou de l'aluminium.
- 3. Procédé selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le composé tensioactif comporte une formule chimique CH₃(CH₂)_nO-SO₃-X, où n est supérieur ou égal à 5 et X est une espèce atomique telle que H, Na, Li ou K.

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce que le composé tensioactif comporte du dodécylsulfate de sodium.

- 5. Procédé selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le composé tensioactif comporte du 2-Butyne-1,4-diol.
- 6. Procédé selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le composé tensioactif comporte de l'acide maléique.
- 7. Procédé selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le composé tensioactif comporte de l'acide succinique.
- 8. Procédé selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le composé tensioactif comporte de l'acide fumarique.
 - 9. Procédé selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le composé tensioactif comporte de l'acide crotonique.

10. Procédé selon l'une des revendications 2 à 9, caractérisé en ce que la concentration du composé tensioactif dans le bain d'électrolyse est sensiblement d'un même ordre de grandeur que la concentration en gallium et/ou en aluminium du bain.

20

25



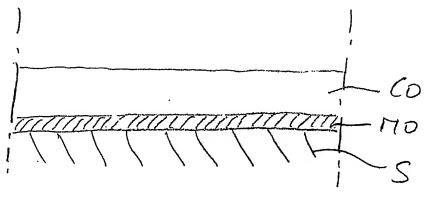
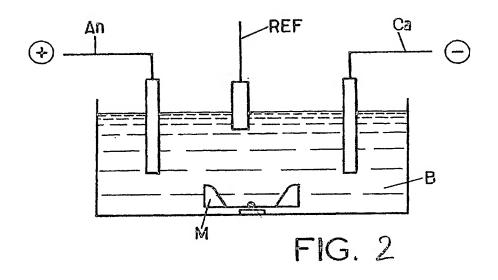


FIG. 1



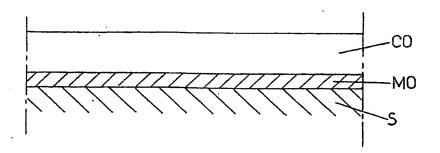


FIG.1.

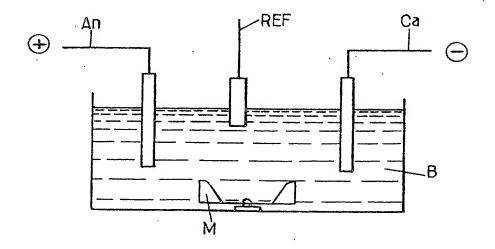
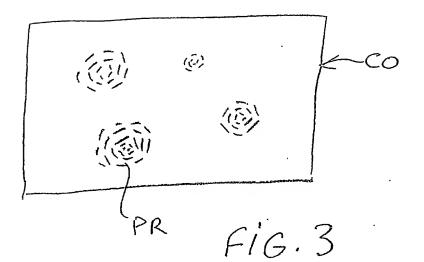
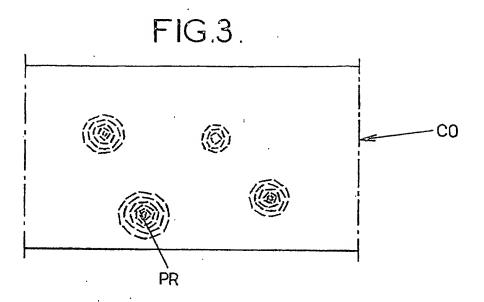


FIG.2.



PR CO

Fig-4



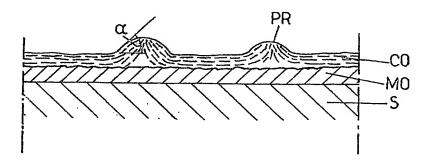


FIG.4.



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire



CB 113 W /260399

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page Nº 1../2..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Vos références ((facultatif)	pour ce dossier	AH/EMA-BFF0202	288	
N° D'ENREGIST	REMENT MATIONAL	(26/16 XM	
TITRE DE L'INVE	ENTION (200 caractères ou esp	aces maximum)		
PROCEDE DE I D'ELEMENTS I	FABRICATION D'UN CON II.	POSE I-III-VI2 EN	N COUCHES MINCES, FAVORISANT L'INCORPORATION	
LE(S) DEMANDE	EUR(S) :			
ELECTRICITE CENTRE NATI	DE FRANCE, SERVICE N ONAL DE LA RECHERCH	ATIONAL E SCIENTIFIQUE	- CNRS	
utilisez un form	N TANT QU'INVENTEUR(S ulaire identique et numéro	ez chaque page ei	uit à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, n indiquant le nombre total de pages).	
Nom		TAUNIER		
Prénoms		Stéphane		
Adresse	Rue	2, RUE CROZATI	ER	
	Code postal et ville	75012 PAR	IS / FRANCE	
Société d'apparte	nance (facultatif)			
Nom		GUIMARD		
Prénoms		Denis		
Adresse	Rue	80a, RUE BOBILL	.OT	
	Code postal et ville	75013 PAR	IS / FRANCE	
Société d'apparter	nance (facultatif)			
Nom		LINCOT		
Prénoms		Daniel		
Adresse	Rue	46, RUE DES SOURCES		
	Code postal et ville	92160 ANT	HONY / FRANCE	
Société d'apparter	nance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU WANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) le 26 DECEMBRE 2002 S. VERDURE (CPI n°97-0901)		Jean State of the		



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ





DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 2../2..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Vos références pour ce dossier AH/EMA-BFF020288			Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire 08 11	13 W /26039		
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) PROCEDE DE FABRICATION D'UN COMPOSE I-III-VI2 EN COUCHES MINCES, FAVORISANT L'INCORPORATION D'ELEMENTS III. LE(S) DEWANDEUN(S): ELECTRICITE DE FRANCE, SERVICE NATIONAL CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - CNRS DESIGNE(NT) EN TART QU'INVERITEUR(S): (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» 5'il y a plus de frois inventour utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant te nombre total de pages). Nom GUILLEMOLES Prénoms Adresse Rue 80a, RUE BOBILLOT Code postal et ville 90, RUE NOCARD Prénoms Pierre-Philippe Rue QRAND Prénoms Pierre-Philippe Rue QRAND Code postal et ville 94220 CHARENTON LE PONT / FRANCE Société d'appartenance (facultatif) Nom Prénoms Rue Rue Rue Rue Code postal et ville 94220 CHARENTON LE PONT / FRANCE		pour ce dossier	AH/EMA-BFF020288	-		
PROCEDE DE FABRICATION D'UN COMPOSE I-III-VI2 EN COUCHES MINCES, FAVORISANT L'INCORPORATION D'ELEMENTS III. LE(S) DEWANDEUR(S): ELECTRICITE DE FRANCE, SERVICE NATIONAL CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - CNRS DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S): (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» 5'H y a plus de frois inventeur utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages). Nom GUILLEMOLES Prénoms Adresse Rue 80a, RUE BOBILLOT Code postal et ville 75013 PARIS / FRANCE Société d'appartenance (facultatif) Nom Prénoms Pierre-Phillippe QRAND Prenoms Pierre-Phillippe Code postal et ville 9, RUE NOCARD Code postal et ville 94220 CHARENTON LE PONT / FRANCE Société d'appartenance (facultatif) Nom Prénoms Rue	N° D'ENREGIST	REWENT NATIONAL	0116XM			
LE(S) DEMANDEUR(S): ELECTRICITE DE FRANCE, SERVICE NATIONAL CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - CNRS DESIGNE(NT) EN TART QU'INVENTEUR(S): (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» 5'il y a plus de frois inventeur utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages). Nom GUILLEMOLES Prénoms Jean-François Adresse Rue 80a, RUE BOBILLOT Code postal et ville 75013 PARIS / FRANCE Société d'appartenance (facultalif) Nom Prénoms Pierre-Philippe Adresse Rue 9, RUE NOCARD Code postal et ville 9420 CHARENTON LE PONT / FRANCE Société d'appartenance (facultalif) Nom Prénoms Rue	TITRE DE L'INVI	ENTION (200 caractères ou es	paces maximum)			
ELECTRICITE DE FRANCE, SERVICE NATIONAL CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - CNRS DESIGNE(NT) EN TART QU'INVENTEUR(\$): (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» \$'ii y a plus de frois inventeur utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages). Nom GUILLEMOLES Prénoms Jean-François Adresse Rue 80a, RUE BOBILLOT Code postal et ville 75013 PARIS / FRANCE Société d'appartenance (facultaif) Nom GRAND Prénoms Pierre-Phillippe Adresse Rue 9, RUE NOCARD Code postal et ville 94220 CHARENTON LE PONT / FRANCE Société d'appartenance (facultaif) Nom Prénoms Rue Rue Rue Rue Rue Adresse Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Ru	PROCEDE DE I D'ELEMENTS	FABRICATION D'UN COI III.	MPOSE 1-111-V12 EN COUCHES MINCES, FAVORISANT L'INCORPORATIO	NC		
ELECTRICITE DE FRANCE, SERVICE NATIONAL CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - CNRS DESIGNE(NT) EN TART QU'INVENTEUR(\$): (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» \$'il y a plus de frois inventeur utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages). Nom						
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(\$): (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» \$'il y a plus de frois inventeur utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages). Nom GUILLEMOLES Prénoms Jean-François Adresse Rue 80a, RUE BOBILLOT Code postal et ville 75013 PARIS / FRANCE Société d'appartenance (facultatif) Nom GRAND Prénoms Pierre-Philippe Adresse Rue 9, RUE NOCARD Code postal et ville 94220 CHARENTON LE PONT / FRANCE Société d'appartenance (facultatif) Nom Prénoms Rue	LE(S) DEMAND	EUR(S):				
utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages). Nom GUILLEMOLES Prénoms Jean-François Adresse Rue 80a, RUE BOBILLOT Code postal et ville 75013 PARIS / FRANCE Société d'apparterance (facultatif) Nom GRAND Prènoms Rue 9, RUE NOCARD Adresse Rue 94220 CHARENTON LE PONT / FRANCE Société d'apparterance (facultatif) Nom Prénoms Adresse Rue Rue						
Nom GUILLEMOLES Prénoms Jean-François	DESIGNE(NT) E utilisez un form	N TANT QU'INVENTEUR(ulaire identique et numéro	otez chaque page en indiguant le nombre total de pages).	teurs,		
Prénoms Jean-François Adresse Rue 80a, RUE BOBILLOT Code postal et ville 75013 PARIS / FRANCE Société d'apparterre (facultatif) Nom GRAND Prénoms Pierre-Philippe Adresse Rue 9, RUE NOCARD Code postal et ville 94220 CHARENTON LE PONT / FRANCE Société d'apparterre (facultatif) Nom Prénoms Adresse Rue			181			
Rue 80a, RUE BOBILLOT Code postal et ville 75013 PARIS / FRANCE Société d'appartence (facultatif) Nom GRAND Prénoms Pierre-Philippe Adresse Rue 9, RUE NOCARD Code postal et ville 94220 CHARENTON LE PONT / FRANCE Société d'appartence (facultatif) Nom Prénoms Adresse Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Patron LE PONT / FRANCE	Prénoms		\$			
Société d'appartenance (facultatif) Nom	Adresse	Rue				
Nom GRAND Prénoms Pierre-Philippe Adresse Rue 9, RUE NOCARD Code postal et ville 94220 CHARENTON LE PONT / FRANCE Société d'apparterance (facultatif) Nom Prénoms Rue		Code postal et ville	75013 PARIS / FRANCE			
Prénoms Adresse Rue Code postal et ville Société d'apparterance (facultatif) Nom Prénoms Adresse Rue Rue Pierre-Philippe CHARENTON LE PONT / FRANCE CHARENTON LE PONT / FRANCE CHARENTON LE PONT / FRANCE Rue Rue	Société d'apparte	nance (facultatif)	·			
Adresse Rue 9, RUE NOCARD Code postal et ville 94220 CHARENTON LE PONT / FRANCE Société d'appartenance (faculiatif) Nom Prénoms Adresse Rue	Nom		GRAND			
Adresse Rue Code postal et ville 94220 CHARENTON LE PONT / FRANCE	Prėnoms		Pierre-Philippe			
Société d'appartenance (facultatif) Nom Prénoms Adresse Rue	Adresse	Rue	9, RUE NOCARD			
Nom Prénoms Adresse Rue		<u> </u>	94220 CHARENTON LE PONT / FRANCE			
Prénoms Adresse Rue		nance (facultatif)				
Adresse Rue						
Autosse	Prénoms	•				
Code postal at villa	Adresse					
		Code postal et ville				
Société d'appartenance (facultatif)	Société d'apparte	nance (facultatif)				
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Plom et qualité du signataire) Le 26 DECEMBRE 2002 S. VERDURE (CPI n°97-0901)	DU (DES) DEMA OU DU MANDAT (Plom et qualité Le 26 DECEMB	NDEUR(S) AIRE du signataire) BRE 2002	Stadows.			

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

PCT/FR2003/003887